国立大学法人九州大学 中央分析センター

第114回 分析基礎セミナー

「原理から学ぶ機器分析【6】表面分析」開催のご案内

下記の日程にて、表記セミナーを開催致しますので、ご案内申し上げます。配布資料の

準備もありますので、事前登録にご協力お願いします。

参加は無料です。申込人数の制限はありません。お気軽にご参加ください。

--------------------------------------------------------------------------------------------

**◆**第114回 分析基礎セミナー「原理から学ぶ機器分析【6】 表面分析」**◆**

【日時】　2017/7/6（木）　13:00-17:00

【場所】　九州大学伊都キャンパス・工学部第3講義室（西講義棟3Ｆ）

【主催】　九州大学中央分析センター

【共催】　九州大学ナノテクノロジープラットフォーム

【協力】　株式会社島津製作所、日本電子株式会社、株式会社堀場製作所

【内容】

**13:00-14:00　X線光電子分光分析（XPS)の基礎と応用**

　　　大気と接する表面は、バルクとはまた違った世界が広がっています。原理的に最表層から数ナノ

メータまでの情報しか取ってこないXPS分析は、それを解き明かす有力な手法の一つと言えます。

また、ケミカルシフトを読み解くことで、単なる元素分析だけでなく表面の化学結合状態をも推測

することができます。このような表面分析の手法であるXPSの基礎から応用を解説していきます。

**14:00-15:00　オージェ電子分光法(AES)の基礎と応用**

試料最表面から約6nmの深さ方向分解能を有するオージェ電子分光法(AES) は，バルクとは

異なる試料表面の特性，主に組成分析，元素分布，化学結合状態分析，更にイオンエッチン

グと併用した材料の深さ方向分析も得意な装置です。本講演ではその信号計測原理から材料

分析事例を紹介します。

**15:10-16:10 「電子プローブマイクロアナライザー(EPMA)の基礎と応用**

試料の表面から約1mmの領域における，局所の微量元素分析を特徴とする，電子プローブ

マイクロアナライザー(Electron Probe Microanalyzer, EPMA) の信号計測原理から幾つかの

材料分析事例を紹介します。また，最近開発された軟Ｘ線分光器　(Soft X-ray Emission

Spectrometer, SXES) を用いた材料分析事例の紹介を行います。

**16:10-17:00　グロー放電発光表面分析装置GD-OESの基礎と応用**

迅速深さ方向分析であるGD-OES。水素から測定できるというユニークな特徴を持つ装置です。

原理から実際のアプリケーション例までご紹介します。

九州大学中央分析センター伊都分室・渡辺宛

　　　**ＦＡＸ　:**　 **092-802-2858**

　　 **ＴＥＬ　 : 　092-802-2857**

**メールアドレス : watanabe.midori.452@m.kyushu-u.ac.jp**

**第114回（平成29年7月6日）**

**分析基礎セミナー参加申込書**

|  |  |
| --- | --- |
| 申込者所属（会社・機関等） |  |
| 申込者氏名 |  |
| 申込者住所等（会社・機関等） | 〒　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　　　　　　　　-　　　　　　-　　　　　　　　　　　　FAX　　　　　　　　-　　　　　　-　　　　　　　　　　　　E-mail　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 参加者 | 部署・職名 |  |
| 氏　　名 |  |
| 部署・職名 |  |
| 氏　　名 |  |
| 部署・職名 |  |
| 氏　　名 |  |

欄が足りない場合は適宜追加お願いします。